## 動態臨界電壓金氧半電晶體之特性 及可靠度研究

## A Study on the Characteristics and Reliability of Dynamic Threshold MOSFETs

研究生: 李耀仁 Student: Yao-Jen Lee

指導教授: 黃 調 元 博士 Advisor: Dr. Tiao-Yuan Huang

趙 天 生 博士 Dr. Tien-Sheng Chao

## 國立交通大學

電子工程學系 電子研究所

博士論文

A Dissertation

Submitted to Department of Electronics Engineering
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of
Doctor of Philosophy
In Electronics Engineering
October 2004
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年十月